

平成 30 年 2 月に発生したトラブル事象について (1 / 1)

		区分Ⅲ
件名	2 系プラズマ熔融分解炉排気(SN 活性炭前)オンラインモニタリング HH 警報発報による「排気漏洩防止設備(SN 活性炭 1 段→2 段)」の起動	
発生日時	平成 30 年 2 月 16 日(金) 18 時 39 分頃	
発生場所	増設処理施設 4 階活性炭吸着塔室(セーフティーネット活性炭) 4 階モニタリング室(No2 PCB オンラインモニタリング装置)(管理区域外)	
環境への影響	なし	
PCB 汚染の可能性	なし	
概要(時刻は頃) (応急措置等)	<p><b>【概要】</b> 2 系プラズマ炉排気(セーフティーネット(以下、「SN」という活性炭前)のオンラインモニタリング(以下、「OLM」という)で HH 警報が発報し、自動的に SN 活性炭は 1 段から 2 段直列に切り換え、手順に従い熔融処理を停止した。</p> <p><b>【時系列】(時刻は頃)</b> 2/16 18:39 2 系プラズマ炉排気 SN 活性炭前の OLM で PCB 濃度 <math>10.1 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math> (<math>\text{O}_2</math> 濃度換算値、参考: <math>\text{O}_2</math> 濃度換算前 <math>4.0 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math>) を記録、HH 警報(HH 警報設定値: <math>9 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math> 以上)が発報。SN 活性炭は 1 段から 2 段直列に切り換わった。当該炉には新たな処理物の投入はせず、熔融処理を停止。 18:52 運転会社から JESCO に連絡。 19:00 HH 警報発報後の SN 活性炭前の 1 回目の OLM で PCB は検出されなかった。 19:20 SN 活性炭 2 連間及び SN 活性炭 2 連後での OLM 実施のため、操作を行ったが、手順に誤りがあり、実行(測定)されなかった。 19:38 SN 活性炭前の 2 回目、3 回目の OLM でも PCB は検出されなかった。 19:41~19:59 SN 活性炭前でのオフラインサンプリング測定(分析員が採取し、分析室での化学分析法による測定)を実施、分析結果(<math>0.9 \mu\text{g}/\text{m}^3</math> 未満)を確認。 19:59 JESCO より運転会社に熔融再開を指示。 (OLM 装置内部データ確認で 4 塩素化物のみの検出であったこと、直後の測定で連続して異常が検出されなかったこと、及び過去に一時的な夾雑成分によるサンプリング異常が発生したことがあったため、今回も同様の事象であると判断できたことから、熔融再開を指示した。尚、原因が一時的な夾雑成分による異常であり、所内周知・行政への通報は行わなかった。) 2/19 10:00 所内関係者による状況確認で、OLM メーカーによる確認と行政への報告・協議が必要と判断、運転会社に熔融再停止を指示。安全に出済した後、11:21 熔融を再停止した。 17:00 メーカーが来所し、現場確認と OLM 装置内部データを確認。夾雑成分による標準試料の信号強度の低下が原因との見解を得た。 2/27 14:30 行政に了解をいただき熔融を再開した。</p>	
事象による影響 (安全への配慮)	<ul style="list-style-type: none"> <li>HH 警報発報時の測定結果は PCB 濃度 <math>10.1 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math> (<math>\text{O}_2</math> 濃度換算値)であったが、OLM 装置内部データの確認と過去事例より夾雑成分による発報であり、環境への影響は無いと判断し、熔融を再開した。その後、OLM で異常は検出されなかったが、念のため熔融処理を再停止した。OLM メーカーにより現場確認、原因の検討を行った後、行政の了解を得て熔融を再開させた。今回、初めての OLM HH 警報発報であったが、SN 活性炭の切替えは円滑に行われ、OLM によるセーフティーネットが機能していた。</li> <li>今後、更なる信頼性向上と緊急時の連絡体制の見直しを図る。</li> </ul>	
発生原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>OLM メーカーより <ul style="list-style-type: none"> <li>①明らかに PCB と思われる信号は確認できない</li> <li>②OLM 警報発報の原因は夾雑成分によるものと推定される</li> </ul> </li> </ul> <p>「サンプリングガスの妨害成分により、標準試料信号が低下(基準の範囲内)している時にノイズを値として検出し、更にこのサンプリング時の状況が高め(12%換算の前提に対して)の <math>\text{O}_2</math> 濃度であったため、<math>\text{O}_2</math> 換算実施後は倍増された」との見解を得た。 なお、発生時の各所温度、排気成分濃度を確認したが、排気処理設備に異常は見られていないが、OLM 装置の排気を導いているバイパスラインテフロンチューブに通常より早い汚れが見られていたことから、夾雑物との関連を確認する。</p>	

